

기판과 열처리 조건에 따른 ZnO 성장 연구

이경주, 이동우, 노지형, 문병무

고려대학교

Thin Film Growth of ZnO dependant upon conditions of Temp. & Substrate

Kyung-Ju Lee, Dong-Woo Lee, Ji-Hyoung Roh, Byung-Moo Moon

Korea Univ

Abstract : Thin film of ZnO was deposited on various substrate by Nd:YAG Pulsed Laser Deposition(PLD) with a wavelength of 355nm. Further more, Thin film of ZnO conducted by various temperature conditions. The surface morphology of the ZnO thin film was investigated by X-Ray Diffraction (XRD) and Atomic Force Microscopy (AFM). Effects of various substrates and Temperature conditions were analyzed. The best properties were obtained on 600°C with post-deposition annealing at 600°C in flowing O₂ atmosphere for several hours.

Key Words : ZnO, Pulsed Laser Deposition(PLD), Various types of substrate, post-deposition annealing

1. 서 론

ZnO(Zinc Oxide) 박막은 가시광선 영역에서 광투과도가 높아서 투명 전도막이나 태양 전지의 전극과 같은 분야에 응용되고 있다. 또한, 압전 특성도 우수하기 때문에 표면탄성파(SAW) 소자나 체적 공진기 필터 (FBAR)에 사용하려는 연구도 활발히 진행되고 있다. 또, ZnO 박막은 정보화 시대의 핵심부품으로 그 중요성을 더해가는 센서들 중 습도센서에도 응용되어지고 있으며, 상온에서 광밴드갭 에너지가 3.37 eV를 가지며[1], 엑시톤 결합에너지(exition binding energy)가 60 meV로서 ZnSe 와 GaN 와 비교했을 때 상대적으로 큰 값을 가지므로 발광소자로서의 응용 가능성도 점차 중요성을 더해 가고 있다.

ZnO 박막의 우수한 물성적 성질이 응용되기 위해서는 다양한 기판에 박막을 성장하였을 경우, 그 구조적 특성 및 표면 상태의 분석이 전제되어야 한다. ZnO 박막의 제작에는 필스 레이저 증착법을 사용하였는데, PLD 증착법은 증착가능 온도 범위가 넓고 산소분압 조절이 용이하며, 강한 에너지를 사용하기 때문에 고품질의 박막을 얻는 것이 가능하다. 본 논문에서는 PLD 증착법을 사용하여 여러 종류의 기판(Si₁₀₀, Si₁₁₁, Al₂O₃, Coarning)과 온도 조건의 변화에 따른 ZnO 박막 성장을 연구하였다.

2. 실 험

표 1은 PLD 증착법으로 ZnO 박막을 제조하는 공정 조건을 나타낸 것이다. 본 실험에서 사용된 챔버의 초기 진공도는 1.5*10⁻⁶에서 진행하였고, 기판온도조절은 SiC 저항가열히터를 사용하였다. Nd:YAG 레이저는 355nm 성분을 사용하여 15분~40분 동안 타겟에 조사하였다. 박막 증착을 위한 타겟은 1-inch(99.99%)의 시료를 사용하였고, 사이즈 1cm*1cm 의 Si₁₀₀, Si₁₁₁, Al₂O₃, Coarning 기판위에 타겟과의 거리를 5cm로 하여 박막을 제조하였다.

표 1. Deposit condition of PLD

Base Pressure	1.7 X 10 ⁻⁵ Torr
Laser	Voltage 1.37 Kv
	Frequency 11 Hz
	Delay time 230 us
Working Pressure	1.5 X 10 ⁻¹ Torr
Energy / Shoot	150mJ

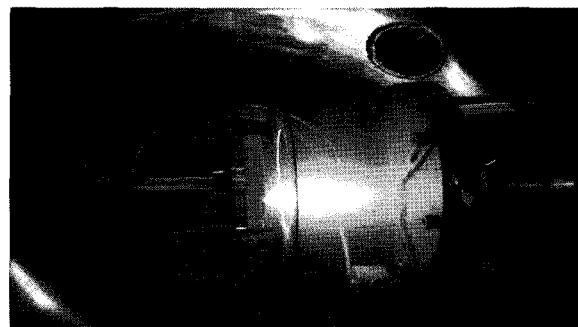


그림 1. Plume Condition of PLD

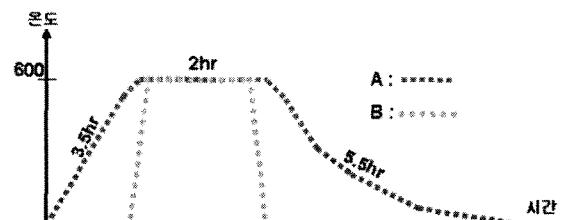


그림 2. 시간에 따른 out-situ annealing 온도 변화

박막 성장의 온도 조건은 200/400/600°C로 변화하며 증착하였고, 챔버내에서 10분동안 in-situ annealing을 한 후에, out-situ annealing으로 전기로에서 600°C의 온도에서 2시간동안 열처리를 하였다. out-situ 열처리 방식은 그림 1.과 같이 두 가지 방법으로 진행을 하였다. A는 11시간동안 서서히 열처리를 진행하였고, B는 2시간동안 급격하게 열변화를 준 것이다. 위와 같은 증착 조건에서 만들어진 시료들을 사용하여 각각 XRD와 AFM으로 분석, 비교하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 기판의 온도변화에 따른 구조적 특성

그림 3.에서 보는 바와 같이 34.5° 근처에서 생성되는 (002) ZnO이 검출된 것으로 보아서, 200°C 이상의 온도에서 생성된 박막이 후열처리를 거치면서 조밀해진다는 결과를 얻을 수 있었다.

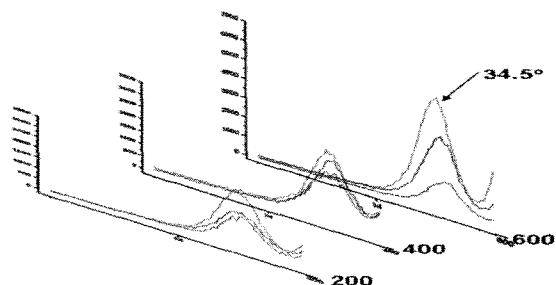


그림 3. 온도별 증착온도에 따른 XRD 스펙트럼

그림 4.에서 살펴볼 수 있듯이 비록 ZnO 박막이 Rods의 형태를 가지지는 못하였으나, 구멍(porous)이 많은 형태의 결정을 형성하여 성장한 것을 볼 수 있다. 이런 다공질 형태의 박막은 ZnO의 부피 대 면적(Surface Area-to-Volume)에 좋은 특성을 가지기 때문에, 때양전지등의 투명전극으로 사용시에 그 효과가 기대된다고 할 수 있다.[2]

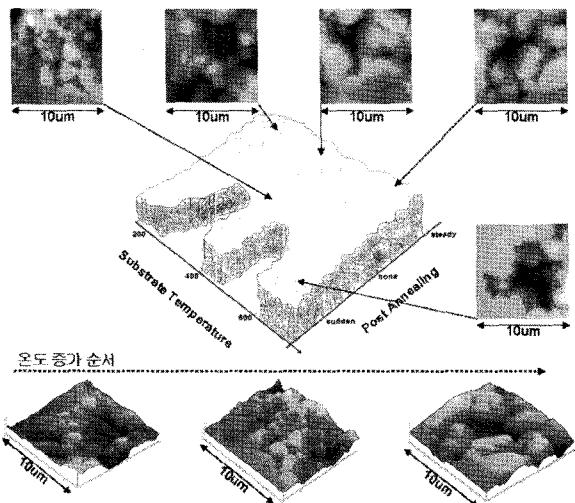


그림 4. 조건별 ZnO 박막의 AFM 측정

온도 변화에 따른 ZnO 박막성장에의 영향은 다음과 같이 요약할 수 있다. 기판온도의 증가는 표면에서 아연과 산소가 결합하기에 필요한 열에너지를 공급하므로 고온에서 박막의 조성이 더 좋다. 그러나, 녹는점이 693K 인 아연을 600°C (873K)에서 박막을 형성하면, 아연의 양이 증가하더라도 400°C 보다 박막의 Intensity 개선 효과가 없음을 알 수 있었다[3].

그러나, 여러 시간동안의 후열처리(out-situ annealing)을 통하여 박막이 가진 다공성의 Uniformity가 많이 개선되어, 박막의 성질 변경이 가능함을 알 수 있다.

3.2 기판의 종류에 따른 구조적 특성

그림 5.에서 보는 바와 같이 34.5° 근처에서 큰 수치의 (002)

ZnO 피크를 관찰할 수 있으나, 아래 AFM에서 보는 바와 같이 다공질 형태로 박막이 생성되지 못하였다. 즉, ZnO의 부피 대 면적(Surface Area-to-Volume)에 좋은 특성을 가진 박막을 만들기 위해서는 기판의 온도는 물론 기판의 결정방향까지도 정확하게 고려해야 함을 알 수 있다.

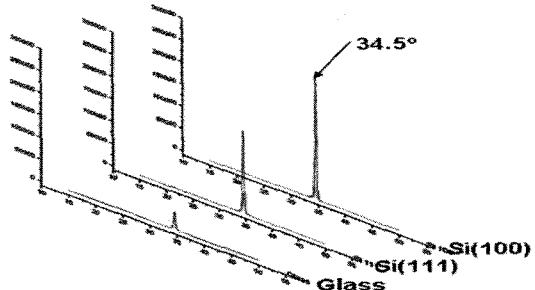


그림 5. 기판의 종류별 XRD 특성

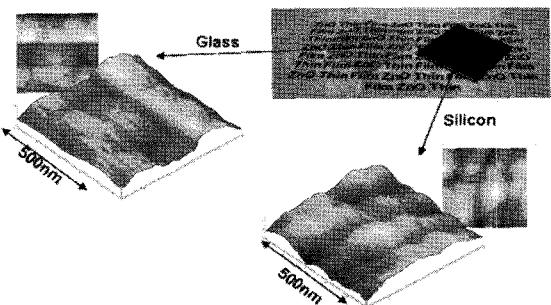


그림 6. Silicon 및 Glass 위에 증착된 박막의 AFM

4. 결 론

PLD 방법으로 다양한 기판과 열처리 조건으로 ZnO 박막 성장을 연구한 결과, 증착시의 온도 및 후열처리 온도/시간에 따라 박막의 구조가 변형이 될 수 있었다. 즉, ZnO 박막 성장시 400°C 에서 증착하고, 600°C 에서 여러 시간의 후열처리 과정을 거치면 부피 대 면적(Surface Area-to-Volume)에 좋은 특성을 가지는 다공질 박막을 얻을 수 있음을 알았다.

감사의 글

본 연구는 2007년도 고려대학교 공과대학 특별연구비의 지원으로 연구되었음

참고 문헌

- [1] Vinay Gupta, "Zinc Oxide Bulk, Thin Films and Nanostructures", Elsevier, 1st Ed, p. 85-87, 2006.
- [2] Michael White, "Production & Analysis of Conjugate Polymer/ZnO Solar Cell", NNIN REU Research, 2005.
- [3] C.Kittel, "Introduction to solid state physics", John Wiley and Son, 7th Ed, p. 58, 1996.